XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451 2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

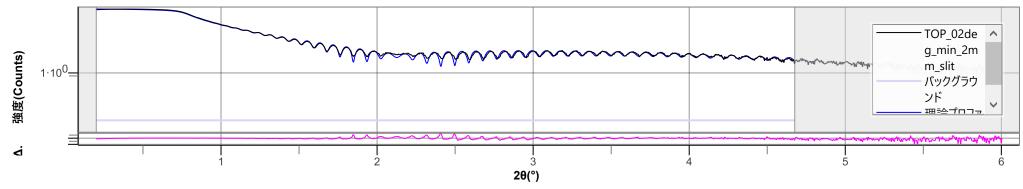
ステップ = 0.004 オフセット=0.000e+000 フィッティング手法: 準ニュートン データ間隔:1点ごとにフィッティング

最大反復数: 500 許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
\checkmark	L5	Fe2O3	1.376	Const	2.47500	Const	1.348	Con
			±0.05	精密化 Const			±0.012 0.100	精密化 Con
\checkmark	L4	Fe2O3	±0.008	精密化	4.95000	Const	±0.03最 小 ←	精密化
✓	L3	Fe	0.949	Const	4.71024	Const	3.900	Con
					±0.04	精密化	±0.9 0.457	精密化 Con
\checkmark	L2	Fe Fe	93.489	Const	7.86952	Const	±0.012	精密化
✓	L1	Fe	1.131	Const	3.93700	Const	0.397	Con
<u> </u>		Si	00		±0.3 最小← 2.32924	精密化 Const	0.500	精密化 Con